

하는 製品으로 移行하고 있다.

나. 새로운 生産拠点 泰国, 香港

이와 같은 生産拠点으로서 새로 나타난 것이 태국이며 현재 생산규모는 아직도 많지 않으나 금후의 有力한 生産拠点이 될 것이 明白하다.

다음으로 크게 바뀌고 있는 것이 香港이다. 表2의 NICS의 대표인 4개국의 生産動向을 나타내고 있다. 이 表은 작년 6월과 금년 6월의 生産実績을 비교한 것으로 한국과 대만은 과거의 高度成長이 주춤해진 感이 있다. 싱가폴, 말레이지아는 유력한 生産拠点으로서의 위치를 유지하고 있는 것으로 생각된다.

여기에서 돌보이는 것은 香港의 움직임으로 다른諸國과는 달리 40%라는 異常成長을 나타내고 있다.

이 成長에는 중국이 관련되어 있다. 즉 香港은 对중국의 輸出, 輸入의 窓口로 되어 있으며 과거의 NICS 諸国에 中国이 가세해 왔다. 중국의 노동임금은 일본보다 두자리대나 낮다고 하며 低価格品의 生産에는 큰 메리트가 있는 것으로 생각되고 있다.

현재는 商社를 중심으로 중국에 部品을 갖고 가서 전자제품을 生产, 香港에서 수출하고 있다.

이와 같이 종전 일본을 크게 위협해온 NICS 諸

国에서의 生産에도 큰 변화가 나타나고 있는데 이들 제품은 아직 높은 技術수준을 필요로 하는 것이 아니며 또한 품질수준도 그다지 높지가 않다.

事實 表1에도 나타나고 있는 바와 같이 東南亞 5개국에서 생산된 電子機器의 生産量과 일본의 生産量을 비교해 보면 TV, 오디오 機器는 일본의 2~3배에 달하고 있으나 비디오는 4분의 1 정도에 그치고 있다.

다. 일본의 対備策

이에 따라 일본의 対備策은 高度의 기술을 필요로 하는 機器로의 전환을 꾀하고 또한 높은 品質, 信頼性이 요구되는 機器로의 전환을 꾀해야 한다는 것이다. 이를 위해서는 機器의 개발, 設計技術, 新しい 분야의 開拓 등 갖가지 対策이 생각되겠으나 이중 하나는 電子機器에 뛰어난 가치를 부여하는 Packaging 技術을 開發하는 것이다. 그같은 뜻에서 수많은 뛰어난 packaging 技術의 開發, 発表가 이루어지고 있으며 그것이 機器에 큰 附加価値를 부여하고 있다. 이와 같은 새로운 Packaging 技術은 새롭고 대단히 고도의 기술처럼 생각되기 쉽지만 실제로는 기존기술의 개량에 의존할 때가 많다.

새로운 Packaging 技術의 開發經緯를 보면 중요

【第1階層】 素子level : chip上의 素子形成相互配線
外部引出lead와의 接続
packaging

Cardlevel : 도터보트 또는 서보트트레이트上
에서의 実裝(受動 및 能動素子)

【第2階層】 boardlevel : mother board上
에서의 実裝
(Card, 受動 및 能動素子)

【第3階層】 架level

【第4階層】 架間

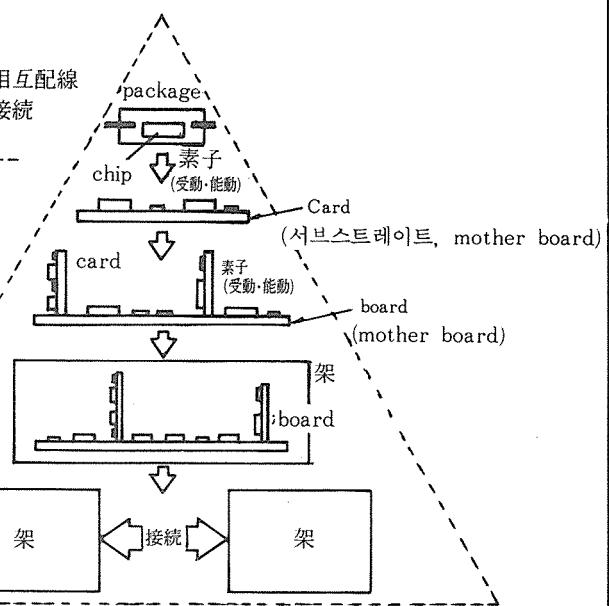


図1 Electronics에 있어서의 実裝 階層構造

한 것은 市場의 needs로 이 needs에 対応하기 위해 갖가지 開發이 추진되고 있다. 成果를 올린 것을 보면 기존기술을 이들 市場 needs에 맞추어 改良, 利用한 경우가 많다. 이와 같이 본다면 새로운 우수한 技術도 의외로 손쉬운 가까운 곳에서 찾아볼 수가 있다.

2. 実装技術의 흐름

電子機器는 電子部品이 없어서는 조립을 할 수 없다는 것은 자명한 이치이며 뛰어난 電子部品이라 뛰어난 機器를 산출한다고 하겠다. 그러나 部品이라 할지라도 部品单独으로는 아무런 역할도 하지 못하며 機器中에 들어가서야 처음으로 그 機能을 発揮한다. 즉 部品의 実装技術은 앞으로 상세히 기술하겠지만 대단히 重要한 역할을 하고 있다.

따라서 뛰어난 実装技術, Packaging 技術이 중요하며 部品의 모양도 이 実装技術에 따라 결정된다고 하겠다. 여기서 좀더 実装問題에 대해 기술하기로 한다. 이 実装이라는 것은 図1에 보이고 있듯이 몇 개의 階層으로 나누어서 생각할 필요가 있다.

가. 第1階層 수준의 実装

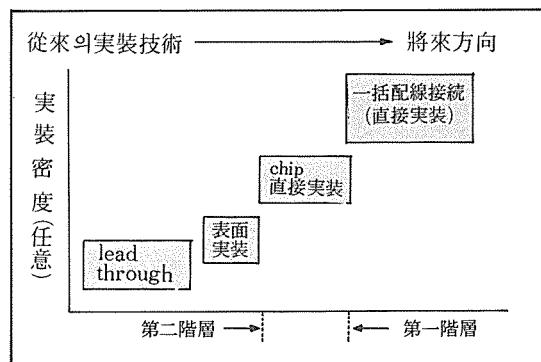
먼저 半導体 LSI 등과 같은 웨이퍼上에서 素子를 형성하고, 素子間의 相互配線을 形成하기 위한 実装이 있다. 더우기 半導体 LSI의 Package를 위해 리드콤에 접속해야한다. 이들 実装은 「第1階層 level」에서의 実装이라 불리워지고 있다. 이 level에서의 実装에는 產·官·學의 분야에 걸쳐 큰 Power가 傾注되어 급속히 진보되고 있으며 集積度도 대단히 빨리 向上되고 있다.

나. 第2階層 level의 実装

그러나 機器를 조립하기 위해서는 이와 같은 LSI를 複數個 사용하고 또한 갖가지 受動部品도 사용하여 基板上에 조립된다. 이와 같은 基板上에서의 組立, 実装은 「第2階層 level」의 実装이라 불리워지고 있다. 이 level의 実装은 보통 瓦楞 技術이 이용되고 있으며 実装密度도 그다지 높지가 않다.

이 level의 実装은 機器를 조립, 뛰어난 性能을 갖게 하여 높은 부가가치를 부여하는데 있어 대단

図2 実装技術의 흐름



히 중요하다. 더구나 実装密度의 면에서 생각하면 이 第2階層 level에서의 実装은 대단히 重要한 역할을 하고 있다고 할 수가 있다. 그러나 서운하지만 이 第2階層 level에서의 実装은 第1階層 level에서의 実装만큼 화려한 것은 없으며 業界중에서의 위치도 낮다고 말하지 않을 수 없다. 이 level의 実装技術은 꾸준한 기술의 축적이며 경우에 따라 인간의 지혜가 활용되어 成果에 이어지는 경우가 많다. 화려한 기술이라고는 말할 수 없으나 產·官·學의 강력한 協力으로 뛰어난 기술을 開發하는데 좀 더 힘써야 하며, 이 기술이 어떠한 위치에 있어야 하는가를 다시 생각해 봐야할 時期에 와 있다고 생각된다.

実装技術은 이와 같이 機器에 있어서 重要한 역할을 지니고 있다. 그러나 機器에 대한 needs는 变

表3 電子機器의 變化에 따른 実装의 대응

I. 高速化, 高周波領域으로의 移行
<ul style="list-style-type: none"> • 高密度実装化, 表面実装化 • 低誘電率基板材料의 開發 · 導入 • 特性인피던스의 整合
II. 高密度実装化
<ul style="list-style-type: none"> • 表面実装化, 低次階層level에서의 接続技術의 導入 • 導体幅의 縮小 • 導体間隔의 縮小 • 구멍의 縮小 • 積層数의增加, 素子의 層間장착
III. 表面実装化
<ul style="list-style-type: none"> • 热膨脹係数의 整合 • 热放散性의 改善 • 耐熱性의 向上 • 耐久性의 向上

化하고 있으며 이에 대응하기 위해서도 実装技術에는 적절한 대응이 필요하다고 할 수 있다.

表3에 이와 같은 機器에 대한 needs의 변화와 이에 대응하는 実装技術을 모아봤다. 이 가운데서도 중요한 것은 表面実装技術로서 実装의 高密度化는 信号伝送의 高速化, 高周波領域에 대한 移行 등과 같은 요구에 대해서도 대응할 수 있는 셈이 된다. 그러나 表面実装技術에서도 実装의 高密度化에 대한 대응에도 한계가 있으며 특히 半導体 LSI의 実装에는 많은 課題가 발생된다. 그리하여 Chip

을 직접 부착하는 방법으로 이에 대응하고 있다.

현재 COB 또는 COG 등과 같은 表現을 가끔 듣고 있지만 이와 같은 表現自體에 문제가 많으며 利用範囲가 限定되어 버리는 우려도 많기 때문에 여기서는 감히 이들과 같은 표현을 피하고 Chip直接組立이라 부르기로 한다.

다. 一括配線이 実装密度를 올린다.

이와 같이 実装密度를 올려 나가기 위해서는 종전의 表面実装의 範疇에 들어있는 技術로는 불충분

表 4 表面実装과 lead through 実装의 比較

実装形態	表面実装	lead through 実装
남땜 랜드의 形状		
表面実装의 主된 利点	<ul style="list-style-type: none"> 原則으로 lead less部品 部品供給, mount 대단히 容易 自動供給用 包裝 容易, 小型 lead through 구멍 不要 端子 Pitch 작게 할 수 있다 ≈ 0.5 Print 基板의 加工 Cost 떨어진다 部品의 高密度 配置可能 信号伝送 pass 載아진다. 信号의 高速伝送에 有利 高密度実装에 적합하다 部品의 mount 와 남땜은 한쪽에서만으로 된다. 両面実装可能 wave, /리플로 양쪽 利用可能 浮遊インダクタンス 대단히 작다. 더우기 固定化 된다. 	<ul style="list-style-type: none"> 리드가 붙은 部品 약간 어렵다 약간 어렵다. 부피가 크다. 必要 구멍(端子) Pitch 制約 있음 ≥ 1.25 구멍 수에 따라서 올라간다 部品의 配置密度는 낮다
表面実装의 主된 課題	<ul style="list-style-type: none"> 모두를 表面実装化하기에는 困難 프로세스가 섞여서 複雜해진다 半導体LSI Package lead의 과인피치에 대한 対応 必要 남땜 工法에는 아직도 課題많음 남땜때의 热 스트레스 크다 설计, 部品/材料에 따라 発生하는 問題많음 基板과 部品의 매칭 必要 組立이 끝난 基板의 信頼性에 影響 部品의 標準化가 必要 	<ul style="list-style-type: none"> 남땜 工法은 거의 確立 部品本体에 대한 热은 基板이 隔離 매칭의 必要是 거의 없다 lead線이 緩衝材로서 작용 標準化는 거의 끝남

하며 上記의 Chip 直接組立, 나아가서는 一括配線接続技術로 나아갈 것으로 생각된다.

이와 같은 実装技術의 흐름을 그림에 나타낸 것이 図 2 이다. 実装의 技術은 階層 level이 낮은 쪽으로 움직이고 있는 듯이 생각된다. 바꾸어 말하면 実装技術은 階層 level에는 관계없이 낮은 階層 level의 実装技術을 이용한 쪽이 実装密度라는 点에 있어서 유리하다고 생각된다.

1) 表面実装技術

이상과 같은 高密度 実装의 요청아래에서 생긴汎用性이 있는 高密度 実装技術의 하나가 表面実装技術이다. 이 表面実装技術을, 종전의 lead through 実装과 비교하여 그 特徵, 課題를 表 4에 표시한다.

이 表面実装技術의 特徵은 部品에 lead가 붙어있지 않든지 붙어 있다고 하더라도 微少化되어 表面実装에 적합한 형상으로 加工되어 있는 것이라 하겠다.

이와 같이 lead線이 없어진 때문에 부품의 취급은 용이해지며 実装은 完全히 基板의 한쪽면으로 끝나며 더우기 余分의 浮遊成分이 極小해지며 그리고 固定化되는 등의 많은 利点이 발생한다.

그러나 한편에서 実装, 특히 납땜 면에서 많은 문제가 發生하며 lead가 微少化했기 때문에 이에 따른 문제도 나오고 있다. 현재의 表面実装技術에서 이와 같은 問題를 해결하는 것이 急先務라 말할 수 있다.

라. 表面実装導入을 成功시킨다.

종전의 表面実装技術은 部品 메이커에 의한 각종

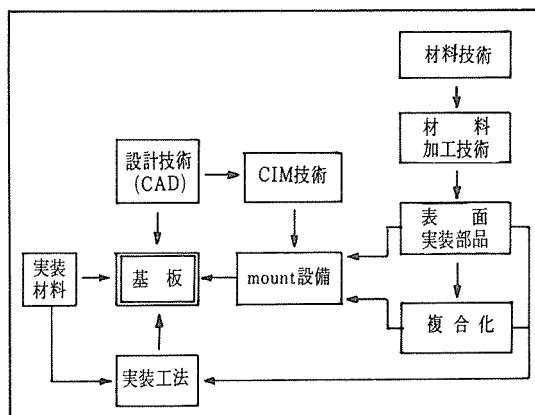


图 3 综合技术로서의 表面実装技术의 새로운 흐름

部品의 表面実装化, 設備 메이커에 의한 自動裝着機의 開發, 이들을 이용한 機器의 表面実装化의 세 가지面에서 추진되어 왔다. 그러나 장래의 表面実装展開를 생각하여 상기와 같은 갖가지 문제를 해결하고 表面実装의 도입을 진정한 뜻에서 성공시키기 위해서는 이와 같은 범위내에서의 表面実装技术의 추진으로는 限界가 있다고 말할 수가 있다.

图 3 은 이와 같이 생각된 새로운 表面実装技术의 흐름을 図示한 것이다. 여기에서 강조하고 싶은 것은 表面実装技术이라는 것은 個個의 技術문제가 아니라 綜合化된 複合技术이라는 点이다. 종전의 機器메이커, 部品메이커, 設備메이커와 같은 Combination만이 아니라 実装材料의 技術, 実装工法에 관련되는 技術, 나아가서 設計技术, 공정을 효율있게 管理하고 製品의 수익률, 信賴性을 維持·向上시키기 위해서는 CIM의 技術導入도 필요하며 図속에 나타난 각기술의 總力結集이 있어야만 진정한 뜻에서 성공할 수 있다고 생각된다. 뛰어난 部品은 뛰어난 제품을 낳는 基本이 되겠지만 이때문에 뛰어난 재료기술, 이의 가공기술이 요구되는 것이다.

종전의 表面実装技术은 上記 3者의 守備範囲가 자연적으로 결정되어 그 境界領域問題가 해결되지 않는 채 버려지는 경향이 짙었다. 금후 表面実装技术을 추진함에 있어서는 이와 같은 守備範囲를 넘어서 문제영역을 명확히 하여 종합적으로 문제의 해결에 나설 필요가 있다.

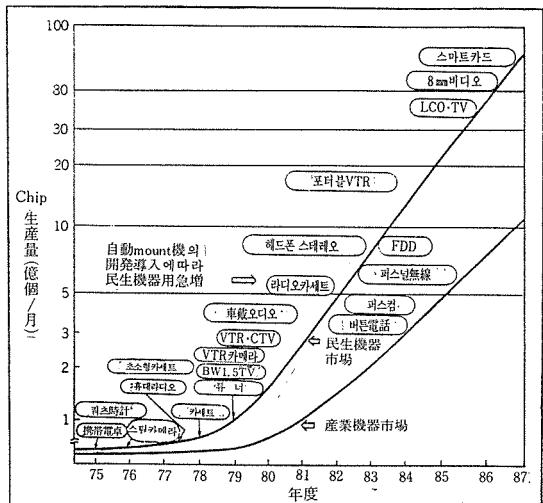


图 4 Chip部品의 拡大動向

表5 世界各國의 表面実装部品의 擴大

単位 : 10億円

		1985年			1990年			1995年		
		lead-through	SMT	COB	lead-through	SMT	COB	lead-through	SMT	COB
美國	集積回路	9.99	0.46	0.65	13.08	6.01	2.01	12.13	20.49	5.23
	受動部品	58.00	9.00	-	45.00	26.00	-	39.00	65.00	-
日本	集積回路	5.65	1.84	0.51	6.71	4.36	1.87	3.73	10.01	3.06
	受動部品	93.00	21.00	-	76.00	36.00	-	63.00	85.00	-
歐州	集積回路	3.05	0.30	0.35	4.99	1.92	0.89	5.35	6.71	2.14
	受動部品	74.00	6.00	-	67.00	16.00	-	54.00	40.00	-
其他	集積回路	2.94	0.11	0.15	5.04	1.15	0.71	5.72	6.96	1.62
	受動部品	63.00	4.00	-	59.00	12.00	-	50.00	35.00	-
計	集積回路	21.63	2.71	1.66	29.82	13.40	5.48	28.93	46.17	12.10
	受動部品	288.00	40.00	-	247.00	90.00	-	206.00	225.00	-

出典 : BPA (Technology & Management) Ltd., England 資料

마. 世界의 表面実装用 部品의 普及은

그러나 部品의 表面実装化, 表面実装用 部品의 보급은 表面実装技術에 있어서 중요한 문제라 할 수 있다.

図4는 이와 같은 表面実装部品의 代表製品인 角板形의 Chip 固定抵抗器, 積層形의 세라믹 콘덴서, 탄탈固体電解콘덴서의 生産数量의 推移를 나타낸 것이다.

그림에서 보는 바와 같이 Chip 部品은 착실하게 신장하고 있다. 한편 이와 같은 表面実装部品의 보급을 세계적인 視野에서 예측한 결과를 表5에 계재했다. 이 表에 의하면 美·歐·日의 表面実装化傾向이 약간 다르게 되어 있다.

1995년의 矛側을 보면 일본은 확실히 受動部品의 表面実装化는 높지만 半導体LSI의 表面実装化는 미국의 절반 정도라는 예측으로 되어 있다.

이는 表面実装의 대상이 되는 製品分野의 차이를 나타내고 있는 것으로 생각된다. 일본은 家庭用 電子機器가 중심이 되고 있으며 그다지 고도의 반도체 LSI素子를 필요로 하지 않는데 대해 미국에서는 半導体 LSI를 대량으로 사용하는 고도의 製品이 많고 表面実装化된다고 생각된다. 이는 일본의 나아갈 방향에도 하나의 示唆를 내포하고 있으며 참고해야 할 것이다.

이상과 같이 금후의 表面実装技術은 새롭고 보다 고도의 技術이 필요로 하는 제품분야로 나아가야하

며 이와 같은 施策에 있어 負荷되는 환경조건도 엄밀해지고 있고 높은 信賴性도 요구되고 있어 図4에도 나타낸 것과 같은 綜合技術, 시스템 技術로서의 表面実装技術의 중요성이 증대한다. 이와 같은 새로운 表面実装의 方向에 대해 당연히 現狀에서 課題가 있으며 필요한 対応策을 강구할 필요가 있을 것이다. 이와 같은 課題와 対応策을 表6에 표시하고 있다.

1) 表面実装用 受動部品

上記와 같이 각종 部品의 表面実装化는 적극적으로 추진되고 있으며 많은 表面実装部品이 시장에 공급되고 있다. 表面実装에서 表面実装化된 部品의 품종이 많을수록 基板을 조립함에 있어 바람직스러운 것이라 할 수 있다. 그러나 모든 부품이 表面実装化되느냐 하면 반드시 그렇지 않으며 몇가지 制約이 따를 것 같다.

表7은 이와 같은 制約의 주된 것을 나타낸 것이다. 적어도 高電力を 소비하는 部品은 基約에 密着하여 mount 하는 表面実装化에는 문제가 있으며 어떠한 배려가 필요하다. 또 크고 중량이 있는 부품에 대해서도 어떠한 배려를 하지 않으면 납땜 接合部의 신뢰성에 문제가 나을 것이다.

이와 같은 表面実装部品의 또 하나의 課題는 이를 小型化하는 것이다. 實裝密度를 올리기 위해서는 당연히 部品의 소형화가 요구되겠고 현재에도 1.0×0.5 의 소형 Chip 部品이 市場에 모습을 보이

記와 같은 갖가지 문제가 발생하여 実用上에서 취급하기 쉬운 적당한 크기를 가지는 것이 바람직스럽다.

사. 複合化 Chip 部品에 의한 実装密度 向上 여기에서 하이브리드 技術을 이용하여 module 化를 꾀하고 또한 부품 내지 素子를 複數個 複合하여 전체의 Package를 취급하기가 적합한 크기로 유지하는 것이다. 이와 같은 複合 Chip 部品에는 인더터와 캐퍼시터가 複合化되어 全体로서 적당한 치수로 Package 되어 있다. 이와 같이 함으로서 実装密度는 다른 要因을 疎外시키는 일이 없이 올릴 수 있으며 납땜 接合部의 数를 줄여 信頼性을 향상시킬 수가 있다.

1) 表面実装用 半導体 LSI

전자기기를 구성하기 위해서는 受動部品만으로는 불가능하며 半導体 LSI도 필요하여 이를 장착하는 기술도 당연히 중요하다 말할 수 있다.

이와 같은 半導体 LSI의 장착방법의 기본은 Package된 半導体 LSI이다. 表10에 이와 같은 半導体 Package의 대표적인 사례를 제시했다. 周知하고 있는 바와 같이 종전의 기본적인 Package는 lead through type인 DIL Package로서 가장 많이 사

용되고 있다. 그러나 実装密度面에서의 制約이 있으며 実装密度를 올리기 위해 lead의 Pitch를 작게 하여 表面実装에 적합한 갈왕 形으로 한 것이 SO Package이다.

더우기 実装密度의 향상을 꾀하기 위해 Package의 4 边에서 lead를 낸 것이 QFP Package이다. 이 Package에서는 Package의 치수를 더욱 작게 하기 위해 lead의 Pitch를 축소하고 있다. 이 결과 reflow 때의 高熱로 Package에 클랙이 발생하기 쉬워지고 또 lead는 가늘고 얇어서 약해져 実装에 있어 Pitch가 흐트러지고 lead가 變形되어 実装上 큰 문제가 되고 있다.

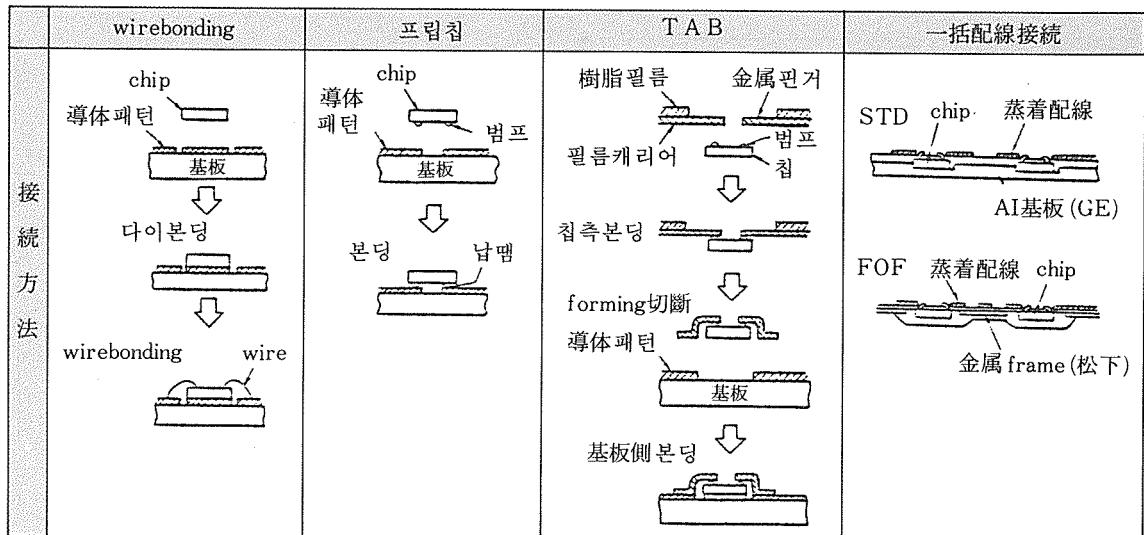
아. tape pack에 의한 対応

클랙의 발생문제는 두고라도 lead의 變形에 의한 実装上의 문제는 크며 갖가지 対応 방안이 취해지고 있다. 그 대책의 하나로 미국의 NS 社가 개발한 tape pack이 있다. 이 package는 銅箔을 etc-hing하여 만든 一層 構造의 carrier tape에 半導体 chip을 bondding하여 그 위에서 樹脂를 mold하여 保護하고 있다. mold는 半導体 chip위는 물론이거니와 lead의 주변부에서도 한다. 이 바깥 쪽의 mold에 의해 lead는 보호되어 있다. 基板上에

表10 表面実装用 半導体 package의 代表例

package形式	外 形	pin 数	lead pitch (mm)	package의 基板占有面積 (64pin相對值)	價 格	熱 放 散	備 考
Dual in Line (DIL)		8~64	100	1	安 價	액 간 良	leadthrough 実 装
Small Outline (SO)		4~28 32~56	50 40	—	"	劣	
Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC)		18~84	50	0.29	"	良	
Quad Flat Plastic (QFP)		44~100	25, 50	0.27	"	良	
Leadless Ceramic Chip Carrier (LCCC)		24~172	25, 40, 50	0.31	高 價	良	
Pin Grid Array (PGA)		72~361	100/50	0.38	非 常 高 價	優	leadthrough 実 装

表11 半導体chip 直接装着의 代表的인 方法



実装할 때는 이 바깥 쪽의 mold部 안쪽에서 lead를 절단, 가공하여 갈왕形의 lead로서 基板上에 実装한다. 이 package를 사용함으로서 半導体 LSI의 package는 종전부터의 裝着機를 이용할 수가 있다.

자. 各種 半導体 chip의 直接 組立方法

아동은 이와 같이 package한 半導体를 実装하는 것은 実装密度에도 한계가 있다. 그래서 chip을 직접 基板上에 実装하는 방법이 고안되어 実用化되고 있다. 이와 같은 半導体 chip의 直接裝着方法의 주된 것을 表11로 표시했다.

가장 일반적인 방법은 wire bondding 法으로 이 wire를 없앤 方法에 프립 칩法, TAB法 등이 있으며 각각 필요로 하는 技術의 내용, level은 달라진다. 이를 방법보다도 더욱 実装密度를 올리기 위해서는 一括配線接続 또는 直接実技工法이 있으나 아직 課題도 많이 남아 있으며 有効한 수단은 없다.

1) 表面実装에 있어서의 mount

表面実装技術은 部品의 自動 mount가 하나의 큰 특징으로 되어있으며 많은 우수한 장치가 판매되어 市場에서 이용되고 있다. 그러나 이를 実装機에 使用者가 완전히 만족하고 있느냐 하면 반드시 그렇다고도 할 수 없다. 図5에 日本프린트回路工業会가 실시한 양케이트 조사 결과를 살펴보자. 家庭用,

産業用電子機器를 구별하지 않고 品種切換变更문제, 실제의 가동률 문제, 취급할 수 있는 부품의 종류, 形状의 문제 등이 큰 문제로서 거론되고 있다.

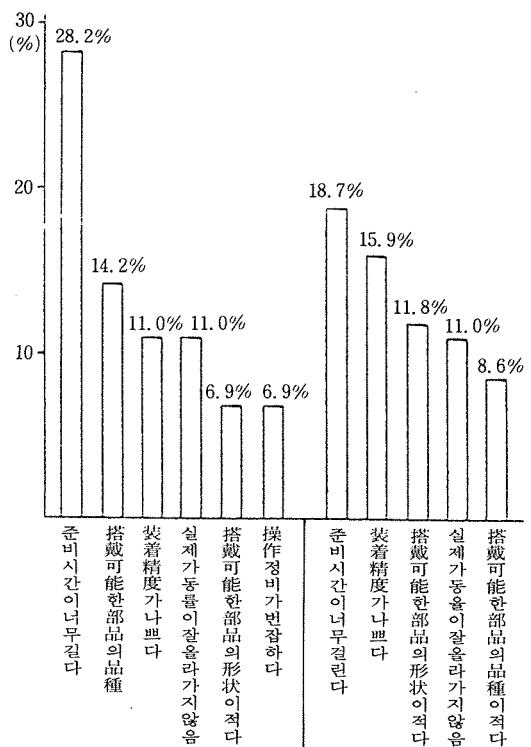


図5 chip装着機의問題 (日本print回路工業会)

表12 chip部品 裝着機의 問題에
對한 対應策의 提案

- I. 基板切換 준비变更 : 基板의 bar code에 의한
識別, 준비변경의 컴퓨터에의한 自動化
- II. 搭載可能한 部品의品种, 形狀 : 數種類의 專
用機의 連結에의한 라인화, 実裝機自体의 問題
- IV. 裝着精度 : 패턴認識機能에 의한 部品의 位置
決定 精度 向上, 実裝機 自体의 問題
- V. 實際의 使用時에 있어서의 積働率 : loss時間
의 分析과 loss時間의 減少

차. chip mounter에 대한 要望이란

이들 課題는 금후 일본의 전자기기 生産이 少量
多品种 방향으로 향할 것으로 예상되는 현재, 큰 과
제라 아니 할 수가 없다.

이와 같은 과제에 대한 대응책의 하나는 back
up computer에 의한 CIM化이다. 이를 위해서라도
1 대의 万能機에 의존하는 것 보다는 몇 대의
専用機를 라인화하여 전체를 컴퓨터에 의해 제어하
는 쪽이 유리해진다. 이와 같은 과제를 해결하는
방안을 表12에 제안한다. 또 이와 같은 裝着機에
대해 設計上에서 배려해야 할 機能을 表13에 제시
했다.

1) 납땜의 問題

그런데 表面実装에 한하지 않고 基板上에 대한
実装에 있어서 당연히 납땜이 필요하지만 表面実装

表13. chip部品 裝着機에 要望되는 機能

- ① 部品의 数, 品種의 収容能力이 를 것.
- ② 基板切換준비变更이 容易할 것.
- ③ CIM이 容易하게 實施될 것.
- ④ 部品裝着時에 基板의 단단이 固定되어 있을 것.
- ⑤ X/Y軸의 移動시스템은 輕量으로 慣性이 적을 것.
- ⑥ 모든 形狀, 치수의 部品에 对해, 確實하게 セン터
링이 可能할 것.
- ⑦ 機械의 精度가 높을 것.
- ⑧ mount에 실패한 부품의 排出
- ⑨ 部品의 定格值確認機能, 不良品의 排出機能
- ⑩ lead의 变形確認機能, 不良品의 排出機能
- ⑪ 不良基板의 確認機能, 排出機能
- ⑫ 組立이 끝난 基板의 排出機能
- ⑬ 部品裝着時의 圧力調整機能
- ⑭ 接着剤의 粘度調整機能
- ⑮ 前後의 工程과의 라인화가 可能할 것.

에 있어서는 이 납땜에도 많은 문제가 포함되어 있
다. 表面実装에서 납땜은 웨이브 또는 deep法 등
으로도 할 때도 있으나 일반적으로는 미리 基板上
에 납을 공급해 두어 부품을 mount하여 그 후 납을
가열, 용융하여 납땜을 하는 이른바 reflow 法이
主体가 된다. 이 납을 용융하기 위해 가열하는 방
법 중 주요한 것을 表14에 제시한다. 이 가운데서
赤外線에 의한 가열방법이 주종을 이루고 있으나

表14 납땜 리플로팅의 主된 加熱方法

加熱方法	原 理	特 徵	短 所
加 热 Tool	各種 形狀의 加熱tool을 接触시켜 热伝導에 의해 납땜을 한다.	<ul style="list-style-type: none"> • tool 形狀이 自由 • 常時加熱, pulse 加熱 • 他部品, 素子에 대한 热影響이 적다 • 热의 集中性이 좋다 	<ul style="list-style-type: none"> • tool의 加压에 의한 位置 어긋남 • 温度의 均一性 • tool에 납이 附着
赤 外 線 炉	赤外線의 辐射热 흡수에 의한 加熱	<ul style="list-style-type: none"> • 連続的, 一括 납땜 • 非接触加熱을 위한 位置의 어긋남이 없음 	<ul style="list-style-type: none"> • 材料에 따라 热吸收가 다르다
氣 化 潜 热	不活性溶剂의 気化潜熱放出에 의한 加熱	<ul style="list-style-type: none"> • 均一加熱 • 温度上昇이 빠르다 • 温度가 正確 • 一括 납땜 	<ul style="list-style-type: none"> • 装置維持費가 높다
レ イ ジ ジ	레이저光의 热에너지에 의한 납땜 CO ₂ , YAG 레이저	<ul style="list-style-type: none"> • 集光性이 좋다. 数 $\mu\text{m}\phi$ • 非接触加熱 • 光파이어에 의한 伝送 	<ul style="list-style-type: none"> • CO₂레이저는 反射率이 크다. • 一括납땜이 困難

부품 본체를 가열해 버릴 위험성이 높다. 이에 대해 蒸氣相加熱法은 加熱溫度를 낮게 억제할 수 있기 때문에 차츰 보급되고 있다. 문제는 사용하는 液이 高価로, 이 液의 loss 때문에 運用cost가 비싸게 먹히는 일이 있다고 일컬어지고 있었으나 최근에는 이 loss를 最小限으로 억제시키는 것도 추진되어 운용cost는 赤外線과 그다지 차이가 없다는 報告도 있다.

이들은 아롱든 납땜 接合部만이 아니라 部品本體도 高溫이 되기 때문에 接合部만을 加熱하는 레이저 빔 加熱法도 최근에는 검토되고 있다. 이 방법은 빔으로 필요한 곳만을 가열하기 때문에 바람직스러운 것이기는 하나 上記의 방법과 같이 全接合部를 일괄하여 빔을 scan하므로 工數의 点에서는 불리하다.

카. 납땜 不良의 現象과 工程要因과의 関聯은

이와 같이 납을 reflow한 결과 여러가지 문제점이 나온다. 이와 같은 문제점은 reflow後에 처음으로 나타나는 것으로 reflow의 工程에 모든 원인이 있는듯이 생각되기가 쉽지만 실제로는 다른 관련되는 공정에 원인이 있는 경우도 많다. 表15에 이와 같은 불량한 現象과 工程의 요인과의 관련성을 표시하고 있다. ◎표를 단 要因은 특히 영향이 크다고 생각되는 요인이다. 이들 불량한 가운데서도 중대한 것은 납브리지, 맨해턴 및 部品移動의 現象, 납땜 接合部의 不完全性, Package의 클래킹 등이지만 이들 不良現象의 주원인을 表16에 표시한다.

이 가운데서 맨해턴 및 部品의 移動現象은 図6

表15 납땜후의 主된 不良과 工程要因과의 関聯

工程要因 不良	基板 (設計포함)	実装材料	実装部品	部品 装着機	実装工法
납브리지	○	○	○		◎
납 템		○	◎		○
납 템 불		◎			○
J리드의 위킹					○
部品의 이동	◎	○	○	○	○
톱스토닝	◎	○	○	○	○
불완전한 납땜 接合部	○	○	○		◎
packaging 의 크래킹			◎		○

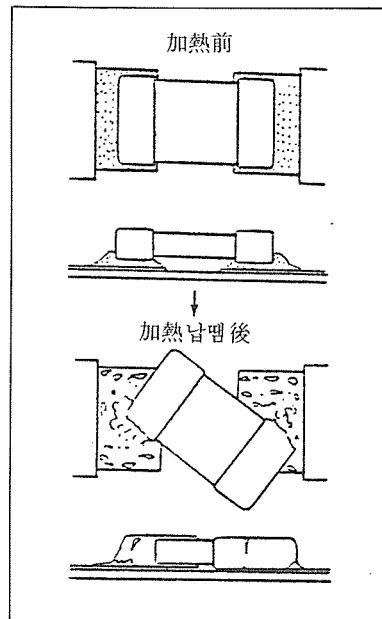


図6. 部品의 移動現象

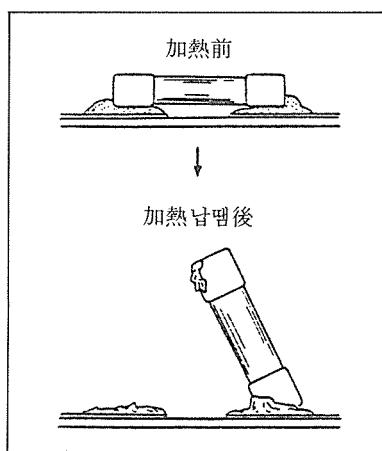


図7. 맨해턴 現象

및 図7에 제시하고 있듯이 부품이 납땜 時에 움직인다든지 基板上에 서버린다는 현상이며 基板上의 Pad가 지나치게 크다든지 납의 양이 너무 많을 경우에 일어나기가 쉽다. 물론 납땜을 하는 부품의 電極이 납땜性이 좋은가에도 원인이 있다.

타. 납땜 Paste의 역할

더우기 이 表面実装에 있어서는 납땜 Paste가 중요한 역할을 하고 있으며 이 납땜 Paste의 성질도 납 reflow를 확실하게 하는데 있어서 중요한 요인

表16. 重要な 不良과 이의 주된 原因

重要한 不良現象	主된 原因
납땜 브리지	납땜 페이스트가 부적절 납땜페이스트의 량(印刷두께)이 너무 많다. 납땜리플로 프로필이 부적당
맨 해턴部品의 移動	납땜pad가 지나치게 크다. 납땜페이스트량(印刷厚)이 불균일하다. 납땜페이스트량(印刷厚)이 너무 많다. 부품의 電極 납땜性이 不均衡
不完全한 납땜接合	납땜 리플로 프로필이 부적당 리드가 뜨는 것이 있다. 납땜재료 또는 량이 부적당
package의 크래킹	리플로시의 가열, 온도상승이 급격하다. 加熱이 局部的이며 不均一 package의 吸湿量이 크다

의 하나가 된다. 이 납땜 Paste라는 재료는 새로운 재료로 불안정한 요소가 크므로 취급하는데 주의를 요한다. 表17에는 이 납땜 Paste의 組成을 나타내고 있다. 이 Paste속의 납땜은 基板上에 공급하기 때문에 작은 알맹이 모양으로 들어 있으며 酸化에 의한 劣化를 일으키기가 쉽다. 이와 같은 납땜 Paste에 요구되는 性質을 表18에 제시한다. 실제로 사용할 때는 공기속에 너무 장시간 방치하는 일이 없이 基板上에 공급하면 가급적 빨리 部品을 mount하여 reflow해버리는 것이 安全하다.

3. Noise 策用 部品의 充実

表17. 납땜 paste의 組成

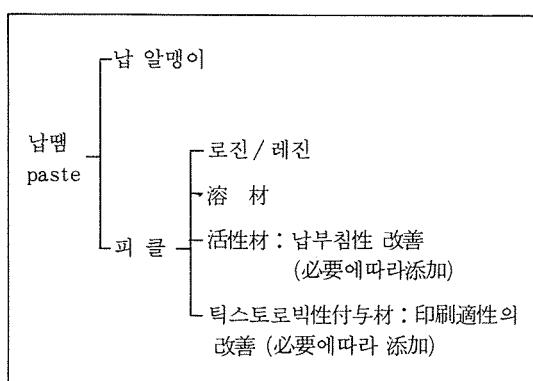


表18. 납땜 paste의 必要 性能

- (1) 空氣中에서의 放置壽命이 길것.
- (2) 吸湿量이 적을것.
- (3) 固形分(납알맹이)의 含有量 많을것.
- (4) 납알맹이의 粒徑은 +200~325 麥斯程度가 적당 하다.
- (5) 部品을 mount 했을때 粘着力을 갖고 있을 것.
- (6) 텍스트로 박성을 갖고 있을 것이 바람직하다.

이상과 같이 實裝, 특히 表面實裝을 중심으로 그 부품의 現狀 및 動向, 나아가서 實裝이라는 工法의 面에서 解説해 왔다. 그러나 최근의 전자기기에서는 또하나 중요한 部品이 있다.

최근의 전자기기 보급에 따라 電磁環境의 악화가 큰 문제로 되어 있다. 이 電磁環境의 악화로 電子機器의 性能에는 나쁜 영향이 주어지고 있다는 뜻에서 被害者의 입장에 있다.

그러나 동시에 電子回路 그것이 有害한 電磁界를 발생하여 다른 回路, 機器에 障害를 주고 있는 셈이 되며 말하자면 加害者의 입장에 있다.

최근의 회로에는 디지털화가 진전되고 있으며 이 디지털화는 이와 같은 有害한 電磁界의 발생을 더욱 助長하는 결과를 냉고 있다. 이와 같은 배경하에서 電子回路로부터 다른 機器로 有害한 영향을 주는 電磁 에너지를 辐射하는 것을 방지하고 동시에 다른 곳에서 有害한 방해를 받는 일이 없이 그것이 갖는 機能을 충분히 발휘할 수 있는 능력이 중요한 과제로 되고 있다.

이와 같은 電磁界의 發生을 방지하고 나아가서 이의 나쁜 영향을 억제하기 위한 것으로 EMI 필터라 불리우는 새로운 部品의 중요성이 높아지고 있다.

파. 重要性이 높아지는 Noise filter

이와 같은 Noise 対策의 기본은 Shield로 Noise 發生源을 완전히 Shield해버리면 上記와 같은 Noise에 의한 방해는 거의 완전히 억제할 수가 있다. 그러나 電子機器에는 電源을 공급할 필요가 있으며 信号를 내고 넣는 것도 필요하다. 게다가 冷却 등에 따라 開口部도 만들 필요가 있으며 완전한 Shield는 실질적으로 불가능하다. 그래서 電子機器가

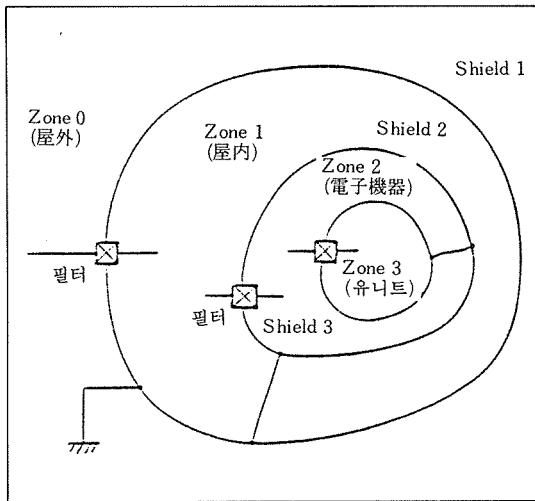


図 8. Shield와 Filter에 의한 対策

두어진 환경屋外, 屋内, 機器本体, 機器를 구성하고 있는 Unit 등의 영역으로 나누어 각각 인접하는領域間을 Shield함으로서 전체의 Shield效果를 높이려는 것이 「Zone의 分離」라는 사고방식으로 図 8에 그概念을 제시하고 있다.

이와 같이 分離, Shield된 zone간의 分離 정도를 악화시켜 Noise에 의한 妨害를 방지하는 效果를 滅殺하는 가장 큰 원인은 zone간의 電源 또는 信号用의 케이블을 통하여 Noise가 伝播하는 것이다. 이와 같은 Noise의 伝播를 방지하기 위하여 Noise 필터가 이용되고 있으며 図11에도 제시하고 있듯이 각zone의 電源, 信号의 出入口에 필터를 插入하고 있다.

이 Noise 필터는 기본적으로는 2端子對回路網으로 L.C 등의 素子로 구성되어 있다. 回路構成에 대해서는 갖가지 방식이 있으며 목적에 맞추어 사용되고 있으나 가장 일반적인 필터의 형식은 低減通過型으로 π 型, T型의 필터構成이 사용되고 있다.

또周波数가 높은 Noise成分을 回路속에서 급속히 減衰시키기 위해 高周波領域에서 抵抗性을 나타내는 ferrite beads를 이용한 beads filter, 초크코일 등이 있다.

이와 같은 필터의 Package는 SL, DIL 등이 많으나 表面実装形의 것도 이미 시장에 나와 있으며 表面実装基板에서도 利用할 수가 있다.

